

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Издание официальное

БЗ 1—2001

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

Метод измерения пробивного напряжения

Semiconductor diodes.
Measurement method of breakdown voltageГОСТ
18986.24—83

ОКП 62 1000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.06.83 № 2681 дата введения установлена

01.07.84

Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)

Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые диоды и устанавливает метод измерения пробивного напряжения.

Общие требования к измерению и требования безопасности — по ГОСТ 18986.0—74.

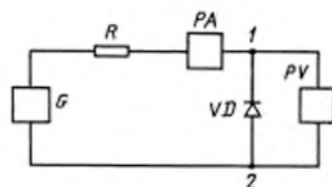
1. УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Пробивное напряжение определяют измерением обратного напряжения, при котором обратный ток через диод достигает заданного значения в области пробоя перехода.

1.2. Значение обратного тока должно соответствовать установленному в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов, при этом значение обратного тока должно быть не менее 10 мкА.

2. АППАРАТУРА

2.1. Измерения следует проводить на установке, структурная схема которой приведена на чертеже.



G — генератор постоянного или пульсирующего напряжения; *R* — резистор; *PA* — измеритель тока; *VD* — испытуемый диод; *PV* — измеритель напряжения

2.2. Значение сопротивления резистора выбирают таким, чтобы при коротком замыкании между выводами 1—2 показания измерителя тока не превышали двукратного значения обратного тока при котором измеряют пробивное напряжение.

2.3. Значение внутреннего сопротивления измерителя напряжения должно превышать не менее чем в 100 раз сопротивление диода в заданном режиме измерения. Погрешность измерителя напряжения должна быть в пределах $\pm 3\%$.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Переиздание. Август 2002 г.

© Издательство стандартов, 1984
© ИПК Издательство стандартов, 2001